

膜厚計の一般校正

校正は、国家標準にトレーサブルな標準器を使用しています。

■ 対象測定器

膜厚計



■ 校正範囲及び校正精度

校正点は以下のとおりとなりますが、校正に使用する標準板は校正点と同値ではなく、実測した近似値のものとなります。

校正範囲	校正精度
10 μm 、25 μm 、37 μm 、50 μm 、 75 μm 、100 μm 、125 μm 、250 μm 、 300 μm 、350 μm 、500 μm 、700 μm 、 800 μm 、1000 μm 、1500 μm	$\pm 2.0 \mu\text{m} \sim \pm 60 \mu\text{m}$ ※校正点により異なります。

注意事項

センサの方式または形名をお知らせください。

取扱説明書の提出をお願いいたします。

調整は当所保有の標準板を使用しますが、お客様の指示がある場合はご相談ください。

アナログタイプの膜厚計の校正はお取り扱いしておりません。

■ 校正のご利用方法



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>